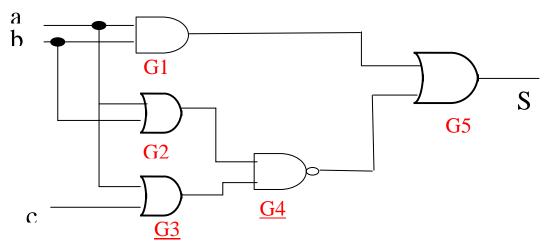
Examen DFT-janvier 2007 Durée 2 heures

Tous documents autorisés

Partie 1: Collages

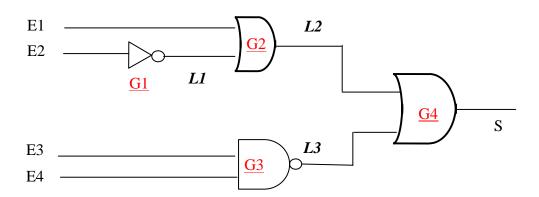
Exercice 1 (4 points)



Soit le circuit A décrit ci-dessus.

- Q1) En utilisant les 3 phases vues en cours (algorithme D simplifié), donnez le vecteur de test permettant de détecter une faute de collage à 1 de la sortie de la porte G1.
- Q2) En faisant l'hypothèse que si un circuit à N equipotentielles il a 2*N fautes de collages possibles, déterminez le taux de couverture obtenu avec le seul vecteur calculé auparavant. Vous expliquerez votre méthode.

Exercice 2 (4 points)



Soit le circuit B décrit précédemment.

Q1) En utilisant l'algorithme D <u>complet</u> vu en cours, donnez le(s) vecteur(s) permettant de détecter le collage à 0 de L3. Vous serez noté sur vos explications.

Exercice 3 (4 points)

Soit un circuit scan ayant comme entrées: E sur 8 bits, SI, SE et CK, et comme sorties S sur 12 bits et SO. Il ne possède qu'une seule chaîne de scan de longueur 3.

- Q1) Qu'est ce qu'un vecteur scan?
- Q2) Dessinez le chronogramme correspondant au test du circuit avec ce vecteur. Vous ferez apparaître tous les signaux nécessaires au test.

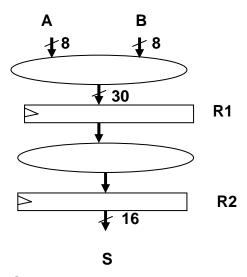
Partie 2: BIST

Exercice 4 (4 points)

Soit le circuit décrit dans l'exercice 3. On veut le tester avec un LFSR et un MISR initialisable par scan.

- Q1) Donnez le polynôme caractéristique du LFSR.
- Q2) Dessinez le LFSR et le MISR.
- Q3) Quelle(s) remarque(s) pouvez vous faire sur le test de ce circuit ?

Exercice 5 (4 points)



On veut tester le multiplieur pipeline décrit ci-dessus en utilisant des bilbos.

- Q1) Dessinez la nouvelle architecture permettant de tester ce circuit en faisant intervenir les bilbos et le(s) multiplexeur(s) nécessaire(s). Faites bien apparaître tous les signaux.
- Q2) Expliquez les phases du test.
- Q3) Proposez un bloc contrôle permettant de réaliser l'autotest complètement autonome du multiplieur (une entrée start_bist, et deux sorties ok_ko et bist_done). Commentez.